リチウムイオン電池用 SiO 負極材料の 軟 X 線 XAFS 測定をもちいた劣化状態解析

Investigation of degradation mechanism of SiO anode material for lithium ion battery by soft X-ray absorption spectroscopy

田野井 昭人 a, 河本 真理子 a, 中川 裕江 a, 稲益 德雄 a, 山中 恵介 b, 小川 雅裕 b, 太田 俊明 b Akihito Tanoi^a, Mariko Kohmoto^a, Hiroe Nakagawa^a, Tokuo Inamasu^a, Keisuke Yamanaka^b, Masahiro Ogawa^b, and Toshiaki Ohta^b

> ^a株式会社 GS ユアサ,^b立命館大学 SR センター ^aGS Yuasa International Ltd., ^bThe SR Center, Ritsumeikan University

リチウムイオン電池用 SiO 負極材料について、軟 X 線吸収分光法(XAFS)をもちいて Si K 吸収端 近傍構造の LiPF₆系電解液浸漬による変化を調査した.その結果,SiO 粒子の表面において,Si K 吸収端スペクトルに新たなピークが確認できた.また,XPS 測定の結果から,Si 2p_{2/3}スペクトルに 新たなピークが確認されたほか,F1s スペクトルでも強いピークが確認された.これらのことから, SiO 表面が,LiPF₆系電解液浸漬によってフッ素化されることが示唆された.

Change of the local structure of SiO anode material for lithium ion battery before and after immersion in LiPF₆-dissolved electrolyte was investigated by Si K-edge through soft X-ray absorption spectroscopy. Si-K edge XANES spectra showed that a new peak appeared on the surface of SiO after immersion in the electrolyte. XPS spectra showed that a new peak appeared in Si $2p_{2/3}$ spectra and a strength peak also showed in F 1s spectra. These results suggested that the surface of SiO was fluorinated by immersion in the electrolyte.

Keywords: Lithium ion battery, SiO, Soft X-ray absorption spectroscopy, XAFS

<u>背景と研究目的</u>: SiO は次世代のリチウム イオン電池用負極活物質として注目されてい る.SiO は高いエネルギー密度を持つが,充 放電サイクルによって継続的な容量低下が起 こるという課題がある.このような,SiO の 充放電初期の挙動についてはメカニズムが報 告がされている^[1].しかしながら,充放電サ イクルにともなう劣化挙動,およびそのメカ ニズムの解析はほとんど報告例がない.

本研究では、劣化状態解析の初期段階として、LiPF₆系電解液浸漬前後のSiOについて、 軟 X 線 XAFS によるSi K 吸収端近傍構造 (XANES)を解析することでその状態の変化を 明らかにすることを目的とした。

実験: SiO電極をエチレンカーボネートと エチルメチルカーボネートとの混合溶媒に LiPF₆を溶解させた電解液に24時間浸漬した. その後ジメチルカーボネートで洗浄し,乾燥 させた.これをSiO粉末,ならびに標準試料 である,結晶質Si,および非晶質SiO₂ととも にAr雰囲気のグローブボックス内にてカー ボンテープで試料台に固定した.これらをト ランスファーベッセルに封入し,大気暴露し ないように測定ラインまで移送した.

軟X線XAFS測定は立命館大学SRセンター のBL-10にて、Si K吸収端スペクトルを取得し た.また、部分蛍光収量法(PFY)によりバル ク、全電子収量法(TEY)により表面の情報を 得た.あわせて、最表面の物質の情報を確認 するためにXPS測定でSi 2p2/3スペクトルとF 1sスペクトルを取得した.

<u>結果と考察</u>: SiO 粉末,ならびに電解液浸 漬後の SiO 電極の PFY による Si K 吸収端 XANES スペクトルを Fig. 1 に,また TEY に よるスペクトルを Fig. 2 に示す.また標準試 料である結晶質 Si,および非晶質 SiO₂のスペ クトルを合わせてしめす.

SiO粉末のスペクトルから,SiOはSiとSiO2の混合状態であることがわかった.電解液浸 漬後の電極では,SiO2のピーク強度が減少す るかわりに, 1851 eV 付近に新たなピークが 確認された.このピークは特に TEY で顕著に 確認されたことから, SiO の粒子表面で起き ている Si 酸化物と電解液成分との反応によ って生成したものであると考えられる.

このピークの生成原因を明らかにするため に、電解液浸漬前後の SiO 電極の XPS を測定 した. Si 2p_{2/3} スペクトルでは、Si 酸化物より も高エネルギー側に強いピークが新たに観測 された.これは Si-O 結合よりも強い結合エネ ルギーを持つ物質が生成していることをしめ している.また、F 1s スペクトルでも、電解 液浸漬後にピークが出現した.

これらの結果から、LiPF₆系電解液に SiO 電極を浸漬することで、Si-F 結合を持つ化合 物が SiO 表面に形成されていることが考えら れる.Si 金属をもちいた負極では、充放電サ イクル後や保存後に、LiPF₆と電解液中の水 分から生成した HF と Si 粒子表面に存在する Si 酸化物が反応し、SiO_xFyが表面に生成する ことが報告されている^[2].SiO 負極でもこれ と同様の反応が起きていると考えられる.さ らに SiO は Si 金属よりも Si 酸化物の存在量 が多いため、より Si 酸化物と HF との反応が 顕著にあらわれるものと推測される.

以上より, 軟 X 線 XAFS 測定を用いること で, LiPF₆ 系電解液浸漬により SiO 負極の表 面がフッ素化される挙動が確認できた.

今後は、得られた知見をもとに、充放電サ イクル後の挙動を調査することで、SiO の充 放電劣化メカニズムを解明したいと考えてい る.

<u>文 献</u>

[1] M. Yamada, A. Inaba, A. Ueda, K. Matsumoto, T. Iwasaki, and T. Ohzuku, *J. Electrochem. Soc.*, **159**, A1630 (2012).

[2] B. Philippe, R. Dedryvère, M. Gorgoi, H. Rensmo, D. Gonbeau, and K. Edström, *Chem*, *Mater.*, **25**(3), 394 (2013).



Fig. 1 Si K-edge XANES spectra under PFY mode of SiO powder (- -) and SiO electrode after immersion in LiPF₆ dissolved electrolyte (—). The spectra of crystal-Si and amorphous-SiO₂ are also shown as reference materials.



Fig. 2 Si K-edge XANES spectra under TEY mode of SiO powder (- -) and SiO electrode after immersion in LiPF₆ dissolved electrolyte (-). The spectra of crystal-Si and amorphous-SiO₂ are also shown as reference materials.